














09:30	KEYNOTE: DIE NEUESTEN TECHNOLOGIEN TESTEN UND IMPLEMENTIEREN							
11:00	KAFFEEPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG							
	LabVIEW Power Programming	Test & Measurement	Verification & Validation	Industrial Internet of Things	Teaching	Semiconductor Test	Workshops	Workshops
11:30	LabVIEW NXG in Automated Test Applications National Instruments	Überwachung, Datenerfassung und Visualisierungssystem in der Energieversorgung des Fusionsexperiments Alexander Sigalov, Claus-Peter Käsemann, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 	HIL-Testumgebung für den Test und die Validierung von Fahrzeugsteuerungskomponenten Georg Kähler, Siemens AG	Anbindung von LabVIEW an IIoT-Plattformen National Instruments	From Control to Mechatronics ... Now on to Smart Systems! Paul Gilbert, Quanser	Aktuelle Trends und neue Produkte für den Halbleitertest Thomas Hartung, COSEDA Technologies GmbH Christian Spiß, National Instruments	Datenmanagement- und Auswerte-Architektur mit DIAdem und X-Frame Josef Eiswirth, measX GmbH & Co. KG	Evaluieren Sie NI-Datenerfassungshardware und Software National Instruments
12:15	LabAR - Extending Real Data Virtually Patrick Steiner, Jascha Eisenberg, Zühlke Engineering AG	Roadmap der NI-Plattform zur Datenerfassung Stefan Albert, National Instruments	HIL JuRTE – Tool-Chain zur ganzheitlichen Restfahrzeugsimulation für DuT Dr. Michaela Härder, Sven Habermann, Jungheinrich Nordstedt AG & Co. KG	Der Mehrwert smarter Informationen Rene Zoelfl, Parametric Technology GmbH	Dezentralisierte Demonstrationsfabrik mit Automatisierungskonzept nach Industrie 4.0 Dr. Marcus Kurth, Sebastian Potzel, HTWG Konstanz 	Hall-Sensor-Testsystem-Retrofitting von VXI auf PXI unter Einsatz der NI-FPGA-Technologie Achim Lott, TDK-Micronas GmbH Christoph Landmann, National Instruments		
13:00	MITTAGSPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG							
14:30	Dynamic Customizable Front Panel Design With LabVIEW Ulf-Hendrik Hansen, WERUM Software & Systems AG	Schwingungserreger für Strukturtests dynamisch belasteter Bauteile Ferdinand Friedrich, IABG mbH Andreas Pfichner, APSysteme GmbH	Automatisierung von Systemprüfständen für Flugzeugfahrwerke auf Basis von VeriStand Andreas Keil, IABG	Mehr Daten, mehr Wissen? Aktuelle Trends in der Prozessüberwachung. Sascha Kamps, WZL der RWTH Aachen Dr. Martin Eckstein, MTU Aero Engines AG	Visualisierungswindkanal für Messe, Forschung und Lehre auf Basis des NI myRIO David Holst, Holst-Consulting Christian Menzel, BIT GmbH - Berliner Institut für Technologietransfer	Globale Standardisierung von Charakterisierungstests bei Melexis Christian Paintz, Melexis GmbH	Prototyping mit der Software-Defined-Radio-Plattform USRP RIO National Instruments 	Intelligente Steuerungs- und Überwachungssysteme mit LabVIEW National Instruments
15:15	LabVIEW Scripting in der Anwendung Karsten Dallmeyer, VIKINGS Software GmbH	Best Practices for Improving Oscilloscope Measurements National Instruments	Bridging the Gap – NI SLSC, die modulare Signalkonditionierungsplattform Bernhard Rennhofer, SET GmbH National Instruments	Machine Learning for National Instruments' Embedded Platforms Philippe Lambinet, Cogito Instruments SA	NI myRIO: Regelerdesign und -simulation für ein aktives Fahrwerk Alexander Schauer, Stefan Reindl, Staatliche Fachschule für Elektrotechnik Altötting			
16:00	KAFFEEPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG							
16:30	Von „Wunsch“ zu „Requirement“ Norbert Brand, National Instruments	Live-Demo – Datenerfassung mit neuer NI-Software National Instruments	Tube Analyzer – Achieving Deeper Data Analysis Results With new Generation Devices for LV 124 Compliance Ronald Kaempf, WKS Informatik GmbH	Mit nur 1 Liter Benzin von London nach Rom und zurück Macro Schmid, Schmid Elektronik 	Praktikum to go: Lehrprojekte mit LabVIEW und Physical-Computing-Plattform Prof. Georg Eggert, Hochschule München	Migrating a Lab from Keysight VEE Pro to LabVIEW and TestStand Christoph Dohrn, Manuel Paukner, Texas Instruments	National Instruments	National Instruments
17:15	Tools Network 7x7 National Instruments and Friends	LabVIEW Based Displays – Online-Prozessdatenvisualisierung während eines Raketenfluges mittels OPC UA und LabVIEW Enrico Noack, Airbus Defence and Space Johannes-Max Bergel, A.M.S. Software GmbH	Design and Implementation of NI VeriStand Custom Device for MTU MCS-5 CAN Protocol Anusha Gourishetty, Jürgen Dodek, MTU Friedrichshafen 	Gefahren des IIoT trotzten – Sicherheit dank NI Linux Real-Time National Instruments	Analog Computing With myDAQ Pocket Labs Dr. Thomas Klinger, Andreas Pester, Carinthian University of Applied Sciences	Power Semiconductor Reliability Testing Combined With Characterization and Dynamic Tests Torben Postel, SET GmbH		
18:00	GET-TOGETHER							

09:00	KEYNOTE: DIE LÖSUNGEN VON MORGEN ENTWICKELN						
10:00	KAFFEEPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG						
	LabVIEW Power Programming	Data Management	Autonomous Vehicle	Automated Test	Business & Technology Trends	Workshops	Workshops
10:30	Best Practices for Transitioning to LabVIEW NXG National Instruments	Continuous Delivery – Wenn neue Daten automatisch neue Reports generieren Andreas Haub, National Instruments	The Evolution of ADAS – Testing Systems That Include Camera, Radar, and Sensor Fusion National Instruments 	Tipps und Tricks für die Architektur von Testsystemen Christian Gindorf, National Instruments	R&D Challenges in an Agile World National Instruments	Datenmanagement automatisieren – Vom Import bis zur serverbasierten Analyse Josef Eiswirth, measX GmbH & Co. KG	Evaluieren Sie NI-Datenerfassungshard- und Software National Instruments
11:15	Software-Lizenzierung unter LabVIEW Dominic Förderer, ProNES Automation GmbH	DIAdem und DataFinder Server – Highlights der aktuellen Versionen Walter Rick, National Instruments	ADAS IIT: One-Stop-Testlösungen für autonomes Fahren ADAS IIT	Transfer From Development to Production of a PXI Based Test System in the NPI Process for Medical Electronics Beatriz Llamazares Gallego, Martin Knoll, Siemens Healthcare GmbH	Praxisbericht: Anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen – Fördermittel erfolgreich erschließen und ausschöpfen Jan Kniewasser, National Instruments TH Ingolstadt Carisma Hochschule München 		
12:00	MITTAGSPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG						
13:30	Professional Software Development for Critical Applications Oliver Wachno, Bürkert Werke GmbH & Co. KG	Standardisierte Bausteine webbasierter Lösungen für Testplanung und Messdatenmanagement Dr. Jan Jacob, Werum Software & Systems AG Stefan Romainczyk, National Instruments	Fahrzeugtest in einer gemischt virtuell/realen Versuchsumgebung Thomas Hempen, Prof. Werner Huber, TH Ingolstadt Carisma 	Produktionstest von Funklösungen in medizinischen Geräten basierend auf WLAN, DECT und Zigbee Axel Bauer, Philips Medizin Systeme 	Digitale Transformation Frank Heidemann, SET GmbH	Automatisierte Testsysteme mit TestStand und PXI erstellen National Instruments	Embedded-Systeme in der Ausbildung und Lehre National Instruments
14:15	Schrittweise Entwicklung einer Anwendung nach dem Model-View-Controll-Prinzip Dr. Ulrich Fickel	Automatisierte Motor-Versuchsdatenauswertung auf Basis von X-Frame und dem NITDM-Server Dr. Joachim Hilsmann, measX GmbH & Co. KG Dr. Michael Roebel, DEUTZ AG	Synchronized Emulation of ADAS Sensor Fusion Targets – Scenarios Michael Konrad, Konrad Technologies GmbH	Modulare Lasersinter-Prüfstandsentwicklung zur Fertigung von künstlichen Herzklappen mittels additiver Fertigung Clemens Kautz, Technische Universität Berlin 	PANEL DISCUSSION - Testing the Autonomous Vehicle		
15:00	KAFFEEPAUSE / BESUCH DER AUSSTELLUNG						
15:30	Anwendung von AF/CF++ auf CompactRIO Dr. Holger Brand, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH	Flexible Auswerte-Workflows mit dem FEVALYS Sequenzer Dr. Matthias Salmen, FEV Software and Testing Solutions	Systemlösungen für Test und Validierung der V2X-Funkkommunikation im Umfeld von ADAS und autonomen Fahren Axel Meinen, Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH  	Standardisierte Plattform - Vereinigung von Produktion und R&D am Beispiel der neuen Audi Infotainment Plattform Manuel von Helden, Noffz Technologies  Olaf Schröder, e.solutions GmbH	Herausforderungen an Startups jenseits des Businessplans Oliver Wachno, Bürkert Werke GmbH & Co. KG		
16:15	LabVIEW Hackers Session 7x7 National Instruments and Friends	Dauerversuchsprüfstand für hydraulische Komponenten mit DIAdem und EtherCAT Holger Müller, a-solution GmbH	Prototypisierung für autonomes Fahren – Test von Automotive Ethernet (AVB/TSN) Peter Förster, AED Engineering GmbH	Vorstellung der neuen Kernkomponenten für Testsysteme National Instruments	Automated Test Outlook Remco Krul, National Instruments		
17:00	ENDE DER VERANSTALTUNG						